

комбинационное) света, оптич. активность, эффект Керра и т. д. Изучение П. и её теория тесно связаны с исследованием межмолекулярных взаимодействий, структуры молекул, особенно таких сложных, как полимеры, в частности белки.

В сильных электрич. полях зависимость $P(E)$ становится нелинейной (см. *Нелинейные восприимчивости*).
А. А. Гусев.

ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ РЕНТГЕНОВСКАЯ — способность вещества поляризоваться под действием внешн. поля рентг. эл.-магн. волны; количественно равна коэф. пропорциональности χ между поляризацией P единицы объёма вещества и единицей напряжённости внешн. электрич. поля E . Свойства П. р. существенно отличаются от поляризуемости атомов, ионов и молекул в поле оптич. диапазона, где при переходе к описанию диэлектрич. свойств вещества вводится понятие диэлектрич. восприимчивости. В рентг. диапазоне длины волн значения этих величин практически совпадают, поэтому обычно ограничиваются введением лишь понятия П. р.

Специфич. особенности П. р. обусловлены 4 причинами: длина волны λ излучения, радиус атома r_a и параметр решётки кристалла a связаны соотношением $\lambda < r_a \lesssim a$; частота излучения ω обычно того же порядка, что и частота атомного K - или L -уровня (для элементов с ат. номером $Z \gtrsim 25$); все уровни энергии атома, лежащие выше K - и L -оболочек, заняты, и переходы на них невозможны; внутр. электронные оболочки атомов, с к-рыми наиб. сильно взаимодействует рентг. излучение, целиком заполнены, сферически симметричны и имеют высокие значения энергии связи. Хим. связь или внешн. воздействия оказывают на внутр. электронные оболочки слабое влияние, поэтому можно считать, что они незначительно отличаются от таких же оболочек свободных атомов.

В рентг. диапазоне введение ср. П. р. теряет смысл. Обычно проводимое усреднение диэлектрич. свойств вещества в объёме с линейными размерами $l \ll \lambda$ невозможно по двум причинам: вследствие малой плотности содержащихся в таком объёме зарядов, а также характерного масштаба локальных изменений электронной плотности, к-рый порядка или больше λ . Поэтому для поляризацию единицы объёма среды $P(r)$ вычисляют в каждой точке пространства с радиусом-вектором r , проводя лишь квантоворехническое усреднение по электронным состояниям. В этом случае в линейном по полю приближении связь между векторами поляризации среды и напряжённостью поля имеет вид

$$P(r) = \hat{\chi}(r)E(r), \quad (1)$$

где П. р. $\hat{\chi}(r)$ — тензорная величина и является ф-цией координат:

$$\hat{\chi}(r) = -r_0 \lambda^2 \hat{\rho}(r),$$

где $r_0 = e^2/(mc^2)$ — классич. радиус электрона, $\hat{\rho}(r)$ — электронная плотность, $\lambda = \lambda/(2\pi)$.

Наиб. ярко особенности П. р. проявляются для кристаллов, где материальный тензор $\hat{\chi}(r)$ из-за трёхмерной периодичности кристаллич. решётки также является трёхмерно-периодической ф-цией координат: $\hat{\chi}(\mathbf{k} + \mathbf{R}) = \hat{\chi}(\mathbf{k})$, где \mathbf{R} — любой вектор трансляции кристаллич. решётки. При рассмотрении отклика среды на возмущение в виде плоской монохроматич. волны необходимо в (1) перейти к фурье-компонентам. Ввиду пространств. периодичности тензора П. р. $\hat{\chi}(r)$ фурье-образ (1) имеет вид

$$P_i(\mathbf{k}, \omega) = \sum_H \chi_{ij}^H(\mathbf{k}, \omega) E_j(\mathbf{k} + \mathbf{H}, \omega), \quad (2)$$

где \mathbf{H} — векторы обратной решётки кристалля. Сумма в правой части ф-лы (2) означает, что в плоскую волну поляризации среды с амплитудой $P_i(\mathbf{k}, \omega)$ и волновым вектором \mathbf{k} дают вклад все поля $E_j(\mathbf{k} + \mathbf{H}, \omega)$, к-рые распространяются в направлениях $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{H}$, от-

личающихся от \mathbf{k} на произвольный вектор \mathbf{H} (см. *Брэга — Вульфа условие*), т. е. имеет место нелокальное взаимодействие полей в пространстве волновых векторов. Диэлектрич. свойства кристалла, следовательно, характеризуются набором П. р. $\chi_{ij}^H(\mathbf{k}, \omega)$, отвечающих возможным направлениям распространения дифракц. волн в кристалле. В ф-ле (2) формально присутствует суммирование по всей бесконечной совокупности векторов обратной решётки \mathbf{H} . Реально в кристалле могут распространяться одновременно лишь неск. полей $E(\mathbf{k}, \omega)$, для к-рых удовлетворяются условия дифракции. Отыскание волновых векторов \mathbf{k}' и амплитуд $E(\mathbf{k}', \omega)$ является задачей теории дифракции рентгеновских лучей.

В первом приближении теории возмущений П. р. χ_{ij}^H многоатомного кристалла пропорциональна теплору структурного фактора $F_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega)$:

$$\chi_{ij}^H = -\frac{N^2}{V m \omega^2} F_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega) \delta_{\mathbf{k}' - \mathbf{k}, \mathbf{H}}, \quad (3)$$

где Кронекера символ $\delta_{\mathbf{k}' - \mathbf{k}, \mathbf{H}}$ указывает на отличие П. р. от нуля только в дифракц. направлениях $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{H}$; m — масса атома. Согласно (3), П. р. отрицательна и по абс. величине составляет $\sim 10^{-8}$. Для одноатомных кристаллов тензор структурного фактора в (3) заменяется на тензор атомного фактора $f_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega)$, в к-рый аддитивно входят разл. вклады: потенциальный $f(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$, очень слабо зависящий от частоты ω и дающий осн. вклад в П. р.; резонансный $\Delta f_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega) = \Delta f_{ij}^{(1)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega) + \Delta f_{ij}^{(2)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega)$, заметный только на частотах, близких к характеристическим; неупругий $\Delta f_{ij}^{(n)}(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; \omega)$, к-рый в свою очередь складывается из теплодиффузного, комптоновского и рамановского (последний вклад имеет дисперсионную зависимость от частоты и не превышает неск. процентов).

Зависимость тензора П. р. от векторов \mathbf{k} и \mathbf{H} — следствие пространственной дисперсии, параметр к-рой $a/\lambda \sim r_a/\lambda \geq 1$ чрезвычайно велик (в оптич. диапазоне $a/\lambda \lesssim 10^{-3}$). Пространственная дисперсия вызывается двумя причинами: трёхмерно-периодич. расположением атомов в решётке, что ведёт к резкому пространственному перераспределению рассеянной интенсивности — дифракции; на ней накладываются монотонная и плавная зависимости П. р. от угла рассеяния, обусловленные внутр. строением атомов и тепловыми колебаниями атомов кристалла. Количественно влияние темп-ры на П. р. учитывается введением *Дебая — Уоллера* фактора.

Т. к. внутр. электронные оболочки, наиб. сильно взаимодействующие с рентг. излучением, целиком заполнены, сферически симметричны и их электроны имеют высокие значения энергии связи, в рентг. диапазоне заметных эффектов оптической активности и анизотропии нет, поэтому электронную часть П. р. обычно можно считать скаляром. Однако деформации электронных оболочек, вызванные хим. связью и анизотропией тепловых колебаний атомов, благодаря дифракции можно наблюдать. Деформация внутр. сферич. электронных оболочек ведёт к понижению симметрии кристалла и, как следствие, к появлению в дифракц. картине новых («запрещённых») дифракц. отражений с малой интенсивностью, появляющихся под иными, нежели разрешённые, углами.

Т. к., согласно (3), $\chi_{ij}^H(\mathbf{k}, \omega) \sim 1/m$, ядра из-за большой массы нуклонов дают по сравнению с электронами преенебрежимо малый вклад в П. р. Однако если кристалл содержит изотопы с низколежащими ядерными резонансами (см. *Мёссбауэрский эффект*), то соответствующее резонансное рентг. излучение взаимодействует не только с электронами, но и с ядрами. Резонансное взаимодействие такого излучения с ядрами весьма интенсивно, так что вклад ядерной подсистемы в П. р. может на порядок превышать вклад от электронов и